



Рис. 3: График зависимости величины $\sqrt{\frac{E}{Ry}}$ от атомного номера Z . Произведена аппроксимация методом наименьших квадратов. По построенным прямым определены коэффициенты их наклона: $k = \sqrt{\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}}$, где n_1, n_2 - уровни переходов при характеристическом излучении, и точки пересечения с осью ординат: $b = -\sigma \cdot k$, σ - искомый коэффициент экранировки. Указанные погрешности – погрешности МНК, без учета систематических.